

【共同利用機器リスト(管理部局別)】

管理部局	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内(※1)		学外		
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金	
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)	
中央分析センター	伊都	超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡 (SU8000)	W3-105	渡辺 (90-2857)	23,000	3,900	28,000	7,600	
		低真空分析走査電子顕微鏡 (SU6600)	W3-103	材工・大上助教 (90-2948)	18,000	3,700	25,000	13,000	
		電子線後方散乱結晶方位解析装置 (Velocity)			1,100(※2)	560(※2)	12,000(※2)	2,400(※2)	
		低真空高感度走査電子顕微鏡 (SU3500)	W3-102	渡辺 (90-2857)	9,300	2,100	12,000	4,000	
		走査電子顕微鏡 (JSM-IT700HR)	W3-101		9,500	2,400	20,000	17,000	
		大気圧走査電子顕微鏡 (AeroSurf1500)	W3-102		8,300	2,000	10,000	3,400	
		全自動水平型多目的X線回折装置 (SmartLab)	W3-202		15,000	3,000	17,000	5,500	
		デスクトップX線回折装置 (MiniFlex600-C)	W3-202		8,800	2,000	9,500	2,600	
		エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (EDX-7000)	W3-203		5,700	3,200	6,100	4,600	
		微小部X線分析装置 (XGT-9000)	W3-203		5,200	2,200	21,000	5,200	
		高分解能3次元X線CTシステム (SKYSCAN1172)	W3-104		34,000	2,700	56,000	6,500	
		高分解能卓上型マイクロCTシステム (SKYSCAN1272)	W3-104		46,000	4,600	55,000	7,100	
		フーリエ変換赤外分光光度計 (FT/IR-620)	W3-205		6,100	920	6,100	920	
		フーリエ変換赤外分光光度計 (FT/IR-4700)	W3-206		5,700	1,100	5,800	1,300	
		マルチチャンネル赤外顕微鏡システム	W3-205		12,000	3,600	13,000	5,500	
		顕微レーザーラマン分光装置 (LabRAM ARAMIS)	W3-207		21,000	5,800	33,000	14,000	
		顕微レーザーラマン分光測定装置 (LabRAM HR Evolution)	W3-207		7,800	12,000	24,000	17,000	
		自動薄膜計測装置 (Auto SE)	W3-206		6,600	1,300	7,900	2,600	
		超伝導核磁気共鳴吸収装置 (JNM-ECZ400)	W3-110		6,500	1,400	8,800	—	
		超伝導核磁気共鳴吸収装置 (JNM-ECZ500)	W3-110		応化・清水准教授 (90-2866)	13,000	1,900	15,000	—
		誘導結合プラズマ質量分析装置 (Agilent 7500c)	W3-106		渡辺 (90-2857)	8,400	4,300	8,400	4,600
		誘導結合プラズマ質量分析装置 (Agilent 7700x)	W3-106			12,000	6,500	12,000	9,600
		誘導結合プラズマ質量分析装置 (Agilent 7900)	W3-106	12,000		5,800	27,000	9,600	
		示差熱熱重量同時測定装置 (TG/DTA7300)	W3-201	15,000		2,400	19,000	4,000	
		高感度示差走査熱分析装置 (X-DSC7000)	W3-201	15,000		2,400	19,000	4,000	
		高温型示差走査熱分析装置 (DSC6300)	W3-201	15,000		2,400	19,000	4,000	
		示差熱熱重量同時測定装置 (NEXTA STA300)	W3-201	—		1,800	—	2,400	
		高温型示差走査熱量計 (DSC404F1)	W3-201	—		6,800	—	9,300	
		走査型プローブ顕微鏡 (Dimension FastScan)	W3-204	17,000		3,100	20,000	5,100	
		走査型プローブ顕微鏡 (Dimension Icon)	W3-204	4,500		7,700	19,000	11,000	
		3D測定レーザー顕微鏡 (OLS4500)	W3-201	13,000		2,500	14,000	3,300	
		フラットミリング装置 (IM-3000)	W3-103	材工・大上助教 (90-2948)		—	1,500	—	2,100
		イオンミリング装置 (E-3500)	W3-103			—	1,500	—	2,100
イオンコーティング装置 (JFC-1600)	W3-101, 105	渡辺 (90-2857)	1,400	930	1,400	930			
イオンスパッタ (MC1000)	W3-102		3,000	1,900	3,100	2,000			
カーボンコータ (SC-701C)	W3-102		2,700	2,100	2,700	2,300			
オスミウムコータ (HPC-1SW)	W3-102, 105		3,100	3,200	3,100	3,600			

管理部門	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内(※1)		学外	
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)
中央分析センター	筑紫	電子線3次元粗さ解析装置(ERA-8900)	中分-102	三浦助教 (93-7214)	-	1,400	-	3,900
		電界放出形走査電子顕微鏡(JSM-6701F)	中分-102		-	2,500	-	3,700
		電界放出型走査電子顕微鏡(JSM-IT800SHL)	中分-201		5,500	3,300	9,400	8,400
		透過型電子顕微鏡(H-7650)	中分-104		-	1,800	-	1,800
		X線回折装置(SmartLabSE)	中分-202		-	2,900	-	5,100
		波長分散型蛍光X線分析装置(ZSX PrimusIV/RX9)	中分-201		5,000	4,400	9,000	9,100
		卓上型触針式プロファイリングシステム(DektakXT-E)			3,900	2,600	5,900	4,400
		ゼータ電位・粒径測定システム(ELSZneo)	中分-306		4,200	3,700	6,300	6,200
		ICP発光分光分析装置Perkin Elmer Avio220Max(ICP発光)	中分-307		3,600	5,400	4,900	7,700
		超高感度示差走査熱量計(DSC6100)	中分-306		-	1,700	-	1,700
		高感度示差走査熱量計(DSC6220)	中分-307		-	1,600	-	1,600
		X線光電子分光分析装置(Axis165)	中分-103		23,000	-	28,000	-
		赤外分光分析装置(FTIR4200 & IRT5000)	中分-306		-	4,300	-	4,600
		走査型プローブ顕微鏡(5500SPM)	中分-201		-	2,400	-	2,600
工学研究院	伊都	ショットキー走査電子顕微鏡(SU5000)	W4-121-3	田中(将)教授 (90-2950)	-	3,500	-	5,100
		電界放出型走査電子顕微鏡(S-4300SE)	EN41-105	森川(龍)助教 (90-2952)	-	2,000	-	-
		オールインワン蛍光顕微鏡(BZ-X800)	W3-609	岸村准教授 (90-2851)	-	660	-	1,300
		フローサイトメーター(CytoFLEX S)	W1-D909	森准教授 (90-2849)	-	2,500	-	-
		レーザーラマン分光光度計(NRS-3100KK)	W3-114	佐々木助教 (90-2833)	5,000/時間	2,300	5,000/時間	2,300
		近赤外蛍光分光装置(NanoLOG-EXT)	W3-612	白木准教授 (90-2841)	-	1,100	-	-
		原子吸光分光光度計(AA-7000)	W3-512	若林准教授 (90-2809)	-	6,400	-	-
		磁化率測定装置(MPMS-XL7TZ)	CE61-102	河江准教授 (90-3521)	-	550	-	550
		差動型高温示差熱天秤(TG-DTA2020SA)	W2-1001	小宮助教 (90-3431)	-	2,900	-	2,900
		攪拌混合造粒機バッチカルグラニュータ	W4-306	井上教授 (90-2757)	-	3,500	-	3,800
		整粒・微粉碎ラボシステム	W4-710		6,500	3,200	6,900	3,600
		卓上型混練機	ラボスペース204		28,000	3,700	32,000	4,600
		卓上型テストコーター ミニラボ	W4-710		8,300	3,200	9,000	3,700
		UV-Vis-NIR 分光光度計	W3-115	藤ヶ谷教授 (90-2845)	-	610	-	-
		全自動水平型多目的X線回折装置(SmartLab)			-	2,300	-	-
		ガス吸着装置	W3-112	藤ヶ谷教授 (90-2842)	-	410	-	-
触媒活性表面測定システム	-	400			-	-		

管理部門	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内		学外		
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金	
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)	
工学 研究院	伊都	マイクロ構造観察電子顕微鏡システム	W3-114	藤ヶ谷教授 (90-2842)	-	3,000	-	-	
		超高分解能走査電子顕微鏡			-	1,600	-	-	
		CCD マルチ ICP 発光分光分析装置	W3-116		-	2,800	-	-	
		電子状態測定システム			-	2,800	-	-	
		ゼータ電位/粒径測定システム	W3-607		-	1,100	-	-	
		高速レーザーラマン顕微鏡			-	2,000	-	-	
		中赤外・遠赤外吸収測定装置			-	690	-	-	
		超高速 HPLC 分離・分子構造分析システム	W3-113, 114		藤ヶ谷教授 (90-2842) 増子技術職員 (90-2845)	-	1,900	-	-
		MALDI-TOF MS 質量分析装置	W3-114		増子技術職員 (90-2845)	-	2,300	-	-
		小角 X 線散乱装置	W3-115		増子技術職員 (90-2845)	-	990	-	-
		単結晶 X 線解析装置			井手技術職員 善技術職員 (90-3308)	-	870	-	-
		透過型電子顕微鏡システム	W3-112		善技術職員 (90-3308)	-	890	-	-
		走査型プローブ顕微鏡 SPM9600	W3-113		善技術職員 (90-3308)	-	1,200	-	-
		ウルトラマイクロトーム EM UC7	W3-116		KIM 学術研究員 (90-2845)	-	1,600	-	-
3次元 SEM 画像測定解析システム VE-8800	W3-114	KIM 学術研究員 (90-2845)	-	1,100	-	-			
人間環境 学研究院	伊都	万能試験機 (UH-2000kNXR)	イ-ストロン構 造実験棟	小山准教授 (90-5223)	-	2,400	-	3,100	
		万能試験機 (UH-500kNX)			-	1,800	-	2,400	
		大型構造物試験機		松尾准教授 (90-5225)	-	15,000	-	19,000	
		振動台			-	11,000	-	14,000	
		汎用アクチュエータ			-	11,000	-	15,000	
農学 研究院 (※3)	伊都	高速液体クロマトグラフ質量分析計 (LCMS-IT-TOF)	W5-305a	赤坂技術職員 (90-4801)	11,000	1,300	11,000	1,300	
		高速液体クロマトグラフ質量分析装置 (LCMS-8050)	W5-305a		8,400	1,600	8,400	1,600	
		レーザーイオン化飛行時間質量分析装置 (AXIMA-Performance)	W5-305b	松永技術職員 (90-4801)	2,400	1,200	2,400	1,200	
		ガスクロマトグラフ (GC-2014AFsc)			3,000	460	3,000	460	
		誘導結合プラズマ発光分光分析計 (5800 ICP-OES)	W5-305c	1,400	4,600	1,900	6,000		
		共焦点・超解像顕微鏡 TCS SP8 STED	W5-307b	奥川技術職員 (90-4801)	-	1,600(※5)	-	-	
		セルソーター Sony SH800	W5-307a	田宮技術職員 (90-4801)	-	1,800(※4)	-	4,700(※4)	
		次世代シーケンサー MiSeq	W5-310	鹿児嶋技術職員 (90-4801)	-	260(※6)	-	-	
核磁気共鳴装置 (JNM-ECS400)	W5-115	鹿児嶋技術職員 (90-4801)	5,600	1,300	5,600	1,300			

管理部門	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内		学外	
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)
農学 研究院 (※3)	伊都	走査型電子顕微鏡システム(SU3500)	W5-116	山口技術職員 (90-4801)	5,300	1,400	5,300	1,400
		デジタルマイクロスコプ(VHX-6000)	W5-307c		5,000	1,100	5,000	1,100
		凍結切片作製装置(CryoStar NX70)	W5-311	鶴田技術専門員 (90-4801)	—	300	—	950
		回転式マイクロトーム(HistoCore AUTOCUT R)			—	210	—	700
総合理工 学研究院	筑紫	X線回折計(Rigaku RINT2200)	総理工 C-107	永長教授 (93-7525)	—	7,100/件	—	7,100/件
		蛍光X線分析装置(Rigaku ZSX-miniX)			—	21,000/件	—	21,000/件
		宇宙空間模擬装置	高速流動棟	山本教授 (93-7585)	—	550	—	1,100
		レーザーラマン分光装置(Nanofinder 30)	GIC 実験室 5	吾郷教授 (93-8852)	—	8,500/件	—	8,500/件
応用力学 研究所	筑紫	重イオン照射システム	応力研研究棟 118・119	渡邊准教授 (93-7717)	234,000	—	234,000	—
	病院	放射性物質対応型強磁性材料ナノクラスター 評価システム(JEM-ARM200CF)	アイトブ総合セ ンター病院地区 実験室 電子顕微鏡室		211,000	—	395,000	—
先導物質 化学 研究所	筑紫	デジタルマイクロスコプ(VHX-900F)	先導研 南-109	田中(雄)技術職員 (93-8898)	890	—	1,100	—
		走査電子顕微鏡(JSM-IT700HR)			4,500/時間	2,400	6,400/時間	4,000
		オスmiumコータ(Tennant20)			3,500	3,100/件	3,900	3,400/件
		核磁気共鳴装置(JEOL JNM-ECA600)	NMR 解析棟	出田技術職員 (93-8898)	7,900	—	7,900	—
		固体高分解能核磁気共鳴装置(JEOL JNM-ECA400)			23,000	—	23,000	—
		電子共鳴装置(JEOL JES-FA200)	先導研 南-401	—	4,500	1,900/件	4,500	1,900/件
		超伝導核磁気共鳴装置(JNM-ECZ400)	先導研 南-107	—	2,300	—	3,500	—
		固体核磁気共鳴装置(ECA 800)	先導研 北-107	出田技術職員 (93-8898)	39,000 (2,200)(※8)	2,200	46,000 (2,600)(※8)	2,600
		固液共用核磁気共鳴装置(JNM-ECX400) 液体・ガス測定			1,600 (540)(※8)	—	2,000 (690)(※8)	—
		固液共用核磁気共鳴装置(JNM-ECX400) 固体測定			7,900 (1,000)(※8)	—	11,000 (1,300)(※8)	—
		二重収束質量分析計(JMS-700)			4,600	—	4,600	—
		マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型 質量分析計(JMS-S3000)	先導研 南-215	今村技術職員 (93-8898)	3,100	—	3,600	—
		コールドスプレーイオン化飛行時間型質量分析装置 (JMS-T100CS)	先導研 南-401	田中(雄)技術職員 (93-8898)	3,200	—	3,200	—
		超強力単結晶構造解析システム(FR-E+)	先導研 北-421	松本技術職員 (93-8898)	42,000	—	134,000	—
		二波長線源型高分解能単結晶X線構造解析装置			30,000	6,200	33,000	7,600
		高輝度広角X線回折システム薄膜解析部(RINT-TTRⅢ)	先導研 北-205	—	20,000	—	24,000	—
高輝度広角X線回折システム熱量同時評価部(SmartLab)	28,000	—			42,000	—		
高分解能小角散乱装置(NANOSTAR)	34,000	—			85,000	—		

管理部局	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	学内		学外	
					分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金
					(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)
先導物質化学研究所	伊都	超高感度測定用 NMR 装置 (AVANCEⅢ 600)	CE41-107	谷准教授 (90-6224)	—	850	—	850
		高分解能二重収束質量分析装置 (JMS-700)	CE41-110	岡崎技術補佐員 (90-6219)	4,700	—	8,500	—
		飛行時間型質量分析計 (JSM-T100CS)	CE41-110	五島助教 (90-6225)	—	370	—	370
		マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置 (Bruker Autoflex II)			—	400	—	400
		X線光電子分光分析装置 (ULVAC-PHI APEX ESCA)	CE41-112	大路テクニカルスタッフ (90-6214)	23,000	940	23,000	940
		二光子共焦点レーザー顕微鏡 (Carl Zeiss LSM 510 Meta NLO)			11,000	650	11,000	650
先端素粒子物理研究センター	伊都	シリコン検出器製造装置	W1-E-801	東城准教授 (90-4053)	—	5,200(※7)	—	5,200(※7)
比較社会文化研究院	伊都	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ (JXA-8530F)	E1-C-723	中野講師 (90-5656)	105,000	—	105,000	—
		高分解能重元素質量分析システム	E1-C-107-3		118,000	—	125,000	—
		レーザーアブレーション ICP-MS			94,000	—	94,000	—
		軽元素同位体分析システム (MAT 253)	E1-C-717	仙田准教授 (90-5653)	99,000	—	265,000	—
		デスクトップX線回折装置 (MiniFlex600)	E1-C-701	桑原教授 (90-5654) 林講師 (90-5655)	—	2,200	—	2,200
生体防御医学研究所	病院	高性能透過型電子顕微鏡 (FEI Polara)	生体防御医学研究所別館高性能 TEM 室	鵜川技術職員 (91-6798)	3,500/時間	3,500(※9)	5,500/時間	3,500(※9)
		汎用透過型電子顕微鏡 (FEI Tecnai20)	生体防御医学研究所別館汎用 TEM 室		1,500/時間	—	3,500/時間	—
		FACSVerse フローサイトメーター	生体防御医学研究所		—	1,800	—	1,800
		細胞単離解析システム (FACSMelody)			—	3,000	—	4,000
		凍結切片作製装置 クリオスタット CM3050S		市川技術職員 (91-6798)	—	300	—	—
		Chromium コントローラー	木庭技術職員 (91-6798)	—	4,000/件	—	4,000/件	
		回折装置 バイオアナライザー		—	780/件	—	780/件	

管理部局	設置地区	装置名	設置場所	装置担当者 (内線)	分類		学内		学外	
							分析依頼料金	利用料金	分析依頼料金	利用料金
							(円/件)	(円/時間)	(円/件)	(円/時間)
生体防御医学研究所	病院	次世代シーケンサー (NovaSeq 6000)	生体防御医学研究所 技術支援室	吉村テクニカルスタッフ (91-6798)	S1	100 塩基	661,000	656,000/件	694,000	689,000/件
						200 塩基	828,000	823,000/件	862,000	857,000/件
						300 塩基	895,000	890,000/件	928,000	924,000/件
					S2	100 塩基	1,230,000	1,225,000/件	1,263,000	1,258,000/件
						200 塩基	1,523,000	1,518,000/件	1,556,000	1,551,000/件
						300 塩基	1,623,000	1,618,000/件	1,656,000	1,652,000/件
					S4	200 塩基	2,180,000	2,175,000/件	2,213,000	2,208,000/件
						300 塩基	2,426,000	2,422,000/件	2,460,000	2,455,000/件
					SP	100 塩基	368,000	363,000/件	401,000	396,000/件
						200 塩基	477,000	472,000/件	510,000	505,000/件
						300 塩基	518,000	514,000/件	552,000	547,000/件
						500 塩基	719,000	715,000/件	753,000	748,000/件

- (※1) 中央分析センターが管理部局となっている設備については、試料の分析等の依頼者が九州・山口地区機器・分析ネットワークの構成機関に所属する者である場合は、本学が管理する経費から支出される場合の利用料とすることができる。
- (※2) SEM(SU6600)料金にEBSDを使用した時間分を加算する。
- (※3) 技術補助が必要な場合は、1時間当たり3,900円を加算する。
- (※4) ソーティングチップを使用する場合は、1枚当たり3,000円を加算する。
- (※5) チャンバーを使用する場合は、1個当たり880円を加算する。
- (※6) ライブラリ調整時に各種消耗品を使用する場合は、以下に定める額を加算する。
- ・ライブラリ調整試薬：1回当たり6,200円
 - ・ライブラリ調整オプション試薬：1回当たり770円
 - ・クオリティチェック試薬：1回当たり4,000円
- (※7) 機器の操作説明が必要な場合は、1時間当たり3,300円を加算する。
- (※8) () 内の額に使用する時間数を乗じたものを加算する。
- (※9) 学外利用者の場合、準備料として1回当たり5,500円を加算する。